多価イオン照射による固体表面からの発光過程

量子·物質工学専攻 山田千樫研究室 阿部崇

概要

多価イオンという粒子の大きな特徴は、物質と相互作用するときに自身の持っている膨大なポテンシャ ルエネルギーを付与することによる反応性の豊かさである。このポテンシャルエネルギー付与により誘起 される現象の観測から相互作用機構を解明する研究はこれまで盛んに行われてきている。しかしながら、 未だ明確な解答というものは得られていない。本研究ではこれまで観測されたことのない、多価イオン衝 突による有機薄膜からの発光を観測し、その相互作用機構に対して考察している。

1.はじめに

一般に2価以上の正負のイオンを多価イオンと 呼ぶが、我々が研究対象としている多価イオンと は、20価~80価程度に電離したイオンである。こ のような高電離イオンは「それ自身が膨大なポテ ンシャルエネルギーを持つ」という点で、非常に ユニークな粒子である。多価イオンの持つポテン シャルエネルギーはそのイオンを生成するための イオン化エネルギーの総和として定義され、価数 *q* と共に急激に増加していく。図1にヨウ素多価イ オンのイオン化エネルギーおよびポテンシャルエ ネルギーと価数との関係を示す。



図 1.ヨウ素多価イオンのポテンシャルエネルギー

1 価のヨウ素イオンのポテンシャルエネルギー は 10eV 程度であるのに対して、裸のヨウ素イオン (I⁵³⁺)は 200keV にまで達する。多価イオンが固 体表面に接近していくと、膨大なポテンシャルエ ネルギーを表面の微小領域(~10 nm)に短時間(~ 10 fs) で注入する。その結果、高い二次粒子(電 子、イオン)放出率、ナノ領域における表面改質 などの特徴的な現象が生じる[1]。このような多価 イオン照射効果は入射粒子の運動量が重要なパラ メーターとなる1価イオンや中性粒子を照射した 場合のそれとは機構が質的に異なる。このような 多価イオンと固体表面の相互作用機構を解明する べく、これまで多くの研究が行われてきている。 それらは主に多価イオン照射効果による二次粒子 放出機構に対するものであり、具体的には二次電 子、正負の二次イオン、中性粒子や多価イオンが 中性化する過程で放出する X 線に対する種類の同 定や収量の評価である。また、多価イオン照射に よる固体表面の改質をラマン分光や SPM (Scanning Probe Microscope)による観察も行われ てきている。しかしながら、多価イオンと固体表 面相互作用機構に対する明確な解答というのは未 だ得られていない。また、多価イオン照射効果に よる固体表面の電子系励起による発光という容易 に想像しうる現象の観測例も未だにない。

そこで本研究では多価イオン照射による固体表 面からの発光を観測し、多価イオン 固体表面相 互作用機構に対して新たな知見を得ることを目的 としている。

2. 試料の製作

多価イオン照射の標的試料として、有機色素で ある bis-MSB を採用した。bis-MSB の化学名、示 性式は下記の通りである。

化学名:p-bis(o-methylstyryl) benzene

示性式:CH3C6H4CH:CHC6H4CH:CHC6H4CH3



🗵 2 . bis-MSB

bis-MSB は工業的には有機色素レーザーや液体 シンチレータなどに利用されており、トルエン中 に 0.2~1.5%の濃度で溶解させた場合、平均発光 波長 422nm,量子収量 0.94,減衰時間 1.3ns とい う特性を示す[2]。bis-MSB を標的として採用した のは、発光波長が検出器の波長感度と一致するこ とや量子収量が高いこと、さらには比較的蒸気圧 が低く高真空実験が可能だからである。図3に bis -MSB 薄膜製作におけるセットアップの略図を示 す。



図3.薄膜の作製

bis-MSB を K-cell[3,4]と呼ばれるエフュージ ョンセルの中に入れ、熱輻射により過熱した。蒸 気となり K-cell から放出された bis-MSB を上方に 設置した水晶式膜厚センサにて蒸着レートを確認 し、ITO (Indium Tin Oxide)基板へ bis-MSB の膜 厚がおよそ 50 nm となるように蒸着した。ITO 基 板は透明であり、bis-MSB の発光波長領域の光を 80%程度透過[5]させる。また、導電性が良いため 基板にバイアスをかけることも可能である。

3.bis-MSBの発光測定

3.1 測定条件

Tokyo-EBIT[6]と呼ばれるイオン源を用いてヨ ウ素の多価イオンを生成し、20価~52価を標的へ と照射した。ヨウ素の原子番号は53番なので52 価のイオンは原子核の周りに電子を1つだけ持つ ので水素様イオンと呼ばれる。これらの多価イオ ンは3.5 kV および5.0 kV で加速させて照射した ので、標的衝突時の多価イオンの運動エネルギー はイオンの価数を *q*とすると *q*×3.5 keV および *q* × 5.0 keV となる。また、照射イオンの強度は 10000 cps 以下で測定した。

標的は bis-MSBを ITO 基板に真空蒸着させたものと、蒸着させていない裸の ITO 基板の 2 つとした。これは bis-MSB on ITO の測定データから ITO の測定データを差し引くことで、bis-MSB からの発光とするためである。

3.2 実験

図5にセットアップの概略図を示す。Tokyo-EBIT から引き出した多価イオンビームを穴あき MCP (Micro Channel Plate), 1mmのアパーチ ャーを経由して標的へと照射した。多価イオンが 標的と衝突すると、標的の表面から多くの二次電 子が真空中へと放出されるので、これを標的の正 面に設置した穴あき MCP で検知した。MCP の出 カパルス信号はアンプ、ディレイを経由してカウ ンターへと接続した。単一多価イオン衝突による 二次電子放出イベントはほぼ 100 %検知できるの で、測定中に何個の多価イオンを標的に照射した のかをカウンターで勘定することができる。一方、 多価イオン衝突により標的の発光が期待されてい るので、標的からの発光は後方に設置した光電子 増倍管 (PMT: Photo Multiplier Tube)により検 出した。光電子増倍管からの出力パルス信号はア ンプを経由して MCA (Multi-Channel Analyzer) という、いわゆる波高分析器へと接続し計数した。 その際、二次電子の信号をゲートとして用いるこ とで、多価イオン衝突イベント以外の不慮な信号 の検出を極力避けるようにした。また、光電子増 倍管は単一光子計数ができるようにビーム軸に沿 って真空チェンバー内で動かせるような機構とし ている。

さらに、測定結果を考察する際の資料とするた め、ビーム軸に対して 60 の位置に Si(Li)の半導 体検出器を設置し、多価イオンが衝突の際に放出 する X 線の収量を測定した。



図5.発光測定のセットアップ

3.3 結果

図6はヨウ素多価イオンの52価を3.5 kVで加 速させ、照射したときに光電子増倍管から出力さ れるパルスの波高分布である。横軸にMCAのチャ ンネル番地、縦軸に各チャンネル番地での強度を とっている。図中の赤線は標的をbis-MSBを蒸着 した ITO 基板としたときのデータであり、青線は 蒸着していない ITO 基板ときのデータである。ま た、黒線はダークカウントを示している。図6よ り多価イオンを ITO 基板に照射したときより、 bis-MSBを蒸着した ITO 基板に照射したときの方 が大幅に強度が増大していることがわかる。この ことから多価イオン衝突により bis-MSB が発光し ていることが確認された。



図6.パルス波高分布

そこで、単一光子計数法[7]により bis-MSB の 発光収量を評価した。図7に結果を示す。



図7の横軸は照射したイオンの価数をとり、縦 軸に単一多価イオン衝突におけるbis-MSBの発光 収量をとっている。図中の赤いシンボルは多価イ オンを5.0 kVで加速し、衝突させたときのデータ であり、黒いシンボルは3.5 kVで加速させたとき のデータである。また、発光収量は測定中に光電 子増倍管で計数した光子の数を照射したイオンの 総数で割り、その値を光電子増倍管の光電面の作 る立体角で近似的に積分し、さらに量子効率で割 ることで算出している。図7より多価イオンを5.0 kVで加速させたときの方が3.5 kVで加速させた ときよりも発光収量が大きいことがわかる。これ らの収量は照射イオンの価数の増大に伴っておよ そ10~100 程度の間で増大している。また、発光 収量は43価で変調はするものの照射イオンの価数 に比例した振る舞いを見せている。照射イオンの 運動エネルギーは価数 q×(加速電圧)の形で表さ れ、価数に比例しているので、図7の横軸を運動 エネルギーとして焼き直して発光収量をプロット すると、図8のようになる。





図8中のシンボル脇の数字は照射イオンの価数 を示している。図8より、ヨウ素多価イオン30価 ~43 価照射による bis-MSB の発光収量は赤いシ ンボルも黒いシンボルの1つの直線に乗ることか ら運動エネルギーに強く依存していることがわか る。逆に言うと、43価~52価の多価イオン照射で の発光収量の際立った増大は運動エネルギーとは 異なったパラメーターに起因していると考えられ る。ヨウ素の43価イオンに注目すると、これはネ オン様イオンと呼ばれ、電子配置は[1s22s22p6]の 閉殻構造をしている。このような閉殻構造を境に した変調は電子殻構造に起因する物理現象により 起こっていると考えられる。そこでネオン様イオ ン(I⁴³⁺)より高価数側の多価イオン照射で誘起さ れる特徴的な物理現象は、多価イオンが中性化す る過程起こる大きなエネルギーを持った X 線(5 keV)の放出や、Auger 電子(4 keV)の放出な どが上げられる。これらの二次粒子放出過程の略 図を図9に示す。43 価より高価数のイオン(I⁴⁴⁺ ~ I⁵³⁺)はL 殻に電子の入ることのできる空席を持



図9.二次粒子放出過程の概略図

っている。このようなイオンが物質と相互作用し て中性化する方法として2通り考えられている。 1つはX線の輻射を伴う場合(図9:左)であり、 もう1つは Auger 過程により内殻を埋める場合 (図9:右)である。後者の場合真空中に4 keV 程度の Auger 電子を放出する。

ヨウ素多価イオンを bis-MSB を蒸着した ITO 基 板に照射したときに放出する X 線のスペクトルを 図 10 に示す。横軸に X 線のエネルギー、縦軸に強 度をとっている。図 10 より水素様多価イオンであ る I⁵²⁺照射時だけ 30~40 keV のエネルギー領域に Kx 線が観測されていることがわかる。Lx 線, Mx 線に対しては 52 価~44 価のイオン照射でそれぞ れ観測されたが、照射イオンの価数の増大に伴っ て強度も増大している。



そこで、単一多価イオン照射あたりの Kx 線, Lx 線, Mx 線の収量をそれぞれ見積もり図 11 に



図 11.X 線収量

示した。横軸に照射イオンの価数をとり、縦軸に 収量をとっている。図 11 より 52 価イオン照射時 の X 線収量に注目すると、Kx 線の収量はおよそ1 となっている。ヨウ素の 52 価イオンは水素様イオ ンなので K 殻に電子の入ることのできる空席を1 つ持っている。つまり、K 殻に空席を持つ多価イ オンが物質と相互作用して中性化する場合、ほぼ 100 %Kx 線の輻射を伴う過程で K 殻の空席を埋 める。一方、Lx 線の収量はおよそ2となっている。 水素様イオンの場合、L 殻に空席を8 つ持っている ので、中性化の過程でそのうち2 つの空席を埋め た場合、残りの6 つの空席は Auger 過程により埋 められる。図 12 にこの過程の概略図を示す。



図 12.二次粒子放出の割合

このような関係はネオン様イオン(I⁴³⁺) ~ ヘリ ウム様イオン(I⁵¹⁺)で考えると、放出される Lx 線とAuger 電子との比はおよそ1:3となっており、 Auger 過程が支配的となっている。また、5 keV 程度のX線(Lx線)は水素原子や炭素原子に対す る断面積が非常に小さいため (H:7×10⁻¹ [barns/ atom], C:4×10² [barns/atom]) 水素や酸素原 子から構成されている bis-MSB (C₂₄H₂₂)への寄 与はほとんど無いと考えられる。

以上のことから、ネオン様イオン (I⁴³⁺)より高 価数の照射での bis-MSB の発光の際立った増大 (図8)は多価イオンが放出する高エネルギーの Auger 電子により bis-MSB の電子系が励起された ためであると考えられる。

4.bis-MSB の発光寿命

多価イオン衝突による有機薄膜からの発光を観 測する最大の利点は、パルス光源を装着した時間 分解蛍光光度計などにより既に測定されている物 性データと比較することで、多価イオン励起によ る発光機構の特異性を議論できるところにある。 ここでは実験室環境の都合から測定しやすい発光 寿命の測定を行った。

4.1 実験

図 13 にセットアップの概略図を示す。多価イオ ン衝突により標的から放出された二次電子の信号 をスタートパルスとし、光電子増倍管からの信号 をストップパルスとして(3.2参照) TAC(Time to Amplitude Converter)へと接続する。TACの 出力は MCA へと接続し測定した。



図 13.寿命測定のセットアップ

4.2 結果

図 14 はヨウ素多価イオンの 52 価(ヘリウム様) を 3.5 kV で加速させ照射したときの TAC からの パスル波高分布である。横軸に時間、縦軸に強度 をとっている。横軸の時間は0がスタートパルス が入力された時間である。また、分布のピークの 位置は図13中のディレイにより任意に調整できる。 図14より、分布が右側に長く裾を引いていること がわかる。bis-MSB の蛍光寿命は一般的に数ナノ 秒程度であることが知られているので、図14に示 されているような長い寿命成分の出現は特異な現 象である。長寿命成分の出現が多価イオン励起に よる独特のものであるとすれば、多価イオンが衝 突の際に bis-MSB から局所的 (~10nm) に電子 を奪い取り、bis-MSB に生成されたホールが周り の電子と再結合する過程により寿命が長くなって いるのではないかと考えられるが、現在この現象 を支持するにあたる実験データはないので、結局 のところは不明である。



図 14.bis-MSB の発光寿命

5.まとめ

本研究では、これまで観測されたことのない固 体表面の電子系励起による発光を観測することが できた。これにより単一多価イオン(I²⁰⁺~I⁵²⁺) 照射で bis-MSB はおよそ10~100個の光子を放出 することがわかった。さらに、bis-MSB の発光収 量は照射イオンの電子殻構造に起因するような価 数依存性があることがわかった。多価イオン衝突 により固体表面から放出される二次電子や二次イ オンに対する研究ではそれらの収量は価数のベキ 乗に比例することが知られているので、図7のよ うな振る舞いの観測は新しいものである。また、 多価イオン励起による bis-MSB の発光寿命にも長 寿命成分が出現するなど、固体表面からの発光の 観測は斬新であり、多価イオン 固体表面相互作 用機構を解釈する上で有意義な測定であると言え る。

参考文献

- [1] 加藤太治,大谷俊介 日本物理学会誌 Vol. 57, No 12, 890 (2002)
- [2] 石川寛昭,「最新液体シンチレーション測定 法」, 南山堂(1992)
- [3] M. Knudsen, Ann. Phys. 28, 75 (1908)
- [4] M. Knudsen, Ann. Phys. 29, 179 (1909)
- [5] ITO 仕様書,フルウチ化学株式会社
- [6] N.Nakamura, H.Shimizu and S.Ohtani, J.Mass Spectrom. Soc. Jpn. Vol. 49, No.229 (2001)
- [7] 木下一彦,御橋廣眞,「蛍光測定 生物科学への応用」,学会出版センター (1983)